



ประกาศคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscope)

ด้วยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้การบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดอัตราค่าบริการให้บริการ ดังนี้

๑. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy) JEOL JEM-๒๐๑๐

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มช.	นักศึกษา/ บุคลากร มช.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าบริการใช้เครื่อง TEM (JEOL JEM-๒๐๑๐) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๓๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๙๐๐	๑,๒๐๐
๒	ค่าบริการใช้ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๔๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐
๓	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๔	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๕	ค่าบริการเครื่อง ชั้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๗๕๐	๑,๘๐๐	๓,๐๐๐

๒. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) JEOL JEM-๖๓๓๕F

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มช.	นักศึกษา/ บุคลากร มช.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าบริการใช้เครื่อง SEM FE (JEOL JEM-๖๓๓๕F) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๓๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๙๐๐	๑,๒๐๐
๒	ค่าบริการใช้ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๔๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐
๓	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๔	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๕	ค่าบริการเครื่อง ชั้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑,๗๕๐	๒,๐๐๐

๓. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) JEOL JEM-๕๙๑๐LV

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มช.	นักศึกษา/ บุคลากร มช.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าบริการใช้เครื่อง SEM FE (JEOL JEM-๕๙๑๐LV) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๑๕๐	๑๕๐	๓๐๐	๔๕๐	๖๐๐
๒	ค่าใช้บริการ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๒๕๐	๒๕๐	๕๐๐	๗๕๐	๑,๐๐๐
๓	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๔	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๕	ค่าบริการเครื่อง ขึ้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๕๐๐	๑,๘๐๐

๔. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) JEOL JEM-IT๓๐๐

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มช.	นักศึกษา/ บุคลากร มช.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าบริการกล้องอิเล็กตรอน (SEM-IT๓๐๐) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๔๐๐	๔๐๐	๗๐๐	๑,๐๐๐	๑,๓๐๐
๒	ค่าบริการ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๔๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐
๓	ค่าบริการ WDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
๔	ค่าบริการ EBSD Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๖๐๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	๒,๔๐๐
๕	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๖	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๗	ค่าแปลผลการตรวจวิเคราะห์ WDS ต่อ Spectrum	๑๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๔๐๐
๘	ค่าแปลผลการตรวจวิเคราะห์ EBSD ต่อ Mapping	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
๙	ค่าบริการเครื่อง ขึ้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	๒,๔๐๐	๓,๐๐๐

/ ๕. กล้องจุลทรรศน์...

๕. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) JEOL JEM-IT๘๐๐

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มข.	นักศึกษา/ บุคลากร มข.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าใช้บริการกล้องอิเล็กตรอน (SEM-IT๘๐๐) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๕๐๐	๑,๖๐๐	๑,๘๐๐
๒	ค่าใช้บริการ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๔๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐
๓	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๔	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๕	ค่าบริการเครื่อง ขึ้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	๒,๔๐๐	๓,๐๐๐

๖. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) EFl Quanta ๒๐๐ ๓D

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มข.	นักศึกษา/ บุคลากร มข.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าใช้บริการกล้องอิเล็กตรอน (FEI Quanta ๒๐๐ ๓D) ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๑๕๐	๑๕๐	๓๐๐	๔๕๐	๖๐๐
๒	ค่าใช้บริการ EDS Microanalyses ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๒๕๐	๒๕๐	๕๐๐	๗๕๐	๑,๐๐๐
๓	ค่าใช้บริการ FIB เตรียมชิ้นงาน ต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)	๖๐๐	๖๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๘๐๐
๔	ค่าพอกผิว/ฉาบผิวชิ้นงานด้วยระบบ GIS ต่อหน้าที่	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๕	ค่าถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต่อภาพ	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๖	ค่าแปลผลวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยเทคนิค EDS ต่อ Spectrum	๓๐	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐
๗	ค่าบริการเครื่อง ขึ้นต่ำ ต่อครั้ง	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	๒,๔๐๐	๓,๐๐๐

๗. ค่าบริการเตรียมตัวอย่าง

ลำดับ	รายการ	นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มช.	นักศึกษา/ บุคลากร มช.	บุคลากร/ หน่วยงาน ของรัฐ	บุคลากร/ หน่วยงาน เอกชน
๑	ค่าบริการ hot mount พร้อมขัดชิ้นงาน แบบประเภท ๑ (สำหรับชิ้นงานที่ไม่ต้องตัด) ต่อชิ้น	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐
๒	ค่าบริการ hot mount พร้อมขัดชิ้นงาน แบบประเภท ๒ (สำหรับชิ้นงานที่ต้องตัด) ต่อชิ้น	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐
๓	ค่าบริการ Cool mount พร้อมขัดชิ้นงาน แบบประเภท ๑ (สำหรับชิ้นงานที่ไม่ต้องตัด) ต่อชิ้น	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐
๔	ค่าบริการ Cool mount พร้อมขัดชิ้นงาน แบบประเภท ๒ (สำหรับชิ้นงานที่ต้องตัด) ต่อชิ้น	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	ค่าเตรียมชิ้นงานทางชีวภาพ สำหรับวิเคราะห์ด้วย SEM ต่อตัวอย่าง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๖	ค่าเตรียมชิ้นงานด้วยเทคนิค CPD สำหรับวิเคราะห์ ด้วย SEM ต่อครั้ง	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐
๗	ค่าฉาบชิ้นงานด้วยทองคำ (Au sputter coat) สำหรับวิเคราะห์ด้วย SEM ต่อครั้ง	๕๐	๕๐	๑๐๐	๑๕๐	๒๐๐
๘	ค่าฉาบชิ้นงานด้วยคาร์บอน (Carbon coat) สำหรับ วิเคราะห์ด้วย SEM ต่อครั้ง	๗๕	๗๕	๑๕๐	๒๒๕	๓๐๐
๙	ค่า Cu Grid ต่อชิ้น	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐
๑๐	ค่าส่งผลข้อมูล หรือส่งตัวอย่างกลับคืนทางไปรษณีย์ ต่อครั้ง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.ชรณินทร์ ไชยเรืองศรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์